ILV

Institut Lavoisier de Versailles

PASTEL DRX

Plateforme PASTEL - DRX

Nom et description de la technique :

La plateforme DRX du laboratoire est constituée de 5 diffractomètres. Les activités se concentrent essentiellement sur la caractérisation structurale de tous types de matériaux cristallisés par diffraction des rayons X.

Equipement(s) :

Diffractomètres poudre : D5000 Siemens, 2 D8 ADVANCE Bruker AXS

Diffractomètres monocristal : X8 APEX II Bruker AXS et D8 VENTURE Bruker AXS

Type de matériaux/échantillons étudiés :
Poudres cristallines et monocristaux

Technologie(s) utilisée(s) :
Diffraction des rayons X

Spécificité(s) :
Monocristal : microsource Molybdène, Basse température Cryostream 800+, détecteur photon III
Poudre : mesures en transmission – capillaire, chambre four haute température HTK 1200N, détecteur LynxEye

Expertise(s) réalisable(s) :
Matériaux polycristallins : analyse qualitative, analyse quantitative de phases, études microstructurales et détermination de structures cristallines
Echantillons monocristallins : résolution et affinement de structures tridimensionnelles

Personne(s) responsable(s) à contacter : Nathalie Guillou – Jérôme Marrot

Complément d'information

Mots clés : diffraction RX, phases cristallines, cristallographie